

课程名称:IC 测试从零开始

**课程简介:**

IC测试在整个IC产业中贯穿了从设计到wafer制造到最后封测的所有环节。本课程从IC业背景和测试基础入手，详细介绍了什么是测试，测试的重要性以及怎么做测试。为无论是IC设计阶段的验证,wafersort阶段的CP测试以及封测阶段的FT测试提供指导和帮助，最后结合实际测试机台（选用Chroma3360）和实际芯片，以实际的测定例子来做讲解

**课程对象:**

将要或正在从事IC测试的工程师(DesignHouse,Fab,Testing) 工作业务和IC测试有关的，对IC测试有兴趣的工程师。

**收费标准:**

1000 RMB/人 (含讲义及午餐；团体另有优惠)

**课程安排**

上课日期	上课时间	课程内容	讲师
第一天	09:00-09:30	IC产业基础知识简介	资深测试工程师
	09:30-10:30	前道工程	
	10:30-10:40	休息	
	10:40-11:50	后道工程	
	11:50-13:00	午餐和休息	
	13:00-14:30	Test Outline	
	14:30-14:40	休息	
	14:40-15:10	Prober Card Introduce	
	15:10-15:20	休息	
	15:20-17:20	Technical Center参观及设备介绍,包括Tester和Prober的基本介绍和操作演示	
第二天	09:00-09:40	What is DC test and how to do it	
	09:40-09:50	休息	
	10:00-10:50	What is AC test and how to do it	
	10:50-11:00	休息	
	11:00-11:50	How to do Function Test	
	11:00-13:00	午餐和休息	
	13:00-14:00	Teat Plan Introduce	
	14:00-14:10	休息	
	14:10-15:10	Teating Project Demo (offline)	
	15:10-15:20	休息	
	15:20-17:20	Online Testing Project Demo Based on (Chroma3360)	

